⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-127816

@Int.Cl. *

證別記号

庁内整理番号

匈公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 G 11 B 7/125 7/14

A 8947-5D 8947-5D

7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

341 B

キヤノン株式会社内

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

会発明の名称

マルチ電子源

②特 顯 平1-267575

②出 願 平1(1989)10月13日

 ②発明者塚本

 ②発明者波辺

健夫信男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

②発明者 奥貫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑪出願人 キャノン株式会社

⑫代 理 人 弁理士 福森 久夫

明和

1. 発明の名称

マルチ電子数

2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ビームを放出する多数の電子機を 縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ビームを被照射体に照射すべ く各前記電子感を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子派において、前記縦列に沿う前記電子派 の配列方向と前記横列に沿う前記電子源の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子派。

3. 発明の詳細な説明

[庭業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト結画用装置、電子 ピーム記録用装置等のように、例えばショット キー型半導体電子振から放出する電子ピームを用 いて電磁かつ高密度の電子ピーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子様に関するものであ る。 【従来技術】

従来、この種のマルチ電子部としては、例えば 米国特許第4259678号明認書、米国特許 4303930号明細書に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 源は、多数の電子源が統列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順後の 配列方向(×方向)と数の配列方向(y方向)と のなす角度が度交したいわゆる単純マトリクスで 配置した様成となっている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の構成では、×方向とッ方向とのなす角度が直交しているので、例えば被照射体たる移動物体に向けて各電子振から電子ピームを放出する場合、電子ピームを移動物体上で連続的に照射させるようにしようとすると、各電子源は固定されていることから、移動物体の移動距離に応じて各電子源を一個すつ個別にもの移動距離に応じて各電子源を一個すつ個別にもの移動距離に応じて各電子源を一個すつ個別に

特闘平 3-127816(2)

ない。後官すれば、従来技術の構成は、制御用に 飲み込ませるデータが多岐になること、電子ピー ムの放出制御が複雑であること、電子ピームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動化体に対する電子ピームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子器を提供すること目、 的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子器を取列をよび規列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ビームを被照射体に照射すべく各前記電子器を順次駆動するようにして成るマルチ電子器において、前記級列に沿う前記電子器の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

[作用]

基板上に配置されたマトリクス状電子悪の検列

は、配銀用の脳段状に形成された板状電艦4が名 イオン注入低域2と交叉するように、すなわち級 方向(各y方向a、b、c、d…)に形成されて いる。したがって、各y方向a、b、c、d…に おける名高速度イオン注入領域3を結ぶ線と各× 方向A、B、C、D…における各高速度イオン注 入領域3を結ぶ線とのなす角度は直交していない (X方向に沿う線(X-X線)とY -Y 線と のなす角度8はBの度よりも小である)。

さらに、前記イオン往入仮域2上には、前記高 講屈イオン往入仮域3から放出された電子を上方 に実内するべく脚状の気極5を介して平屋根状の 電極8が形成されている。

各前記イオン往入領域2の場部の表面部にはそれぞれ高級度拡散層7が形成され、各高級度拡散層7が形成され、各高級度拡散層7上にはオーミックコンタクト部8が天々形成され、各オーミックコンタクト的8上には電極9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極での場部にはそれぞれ電極11が接続されている。

方向と取列方向とが直交しないので、名電子部からお助物体上に退議的に電子ビームを照射する場合、お助物体が一つの電子源とこれに開設する電子源との間をお助する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子派を次々と認動(練順次駆動)させるという単純な制御で行なえる。

[事版例]

従って、マトリクス状に配列された各電子様は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極Bと各y方向s、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子派である高速度イオン注入領域3がON状態となってアバランシェ増幅が生じ、当該高速度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、太実施例では電子源としてショットキー型半導体電子源を用いているが、時にショットキー型半導体電子源である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子競和力)等の各種の半導体電子線を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に照射し、連続的なビーム照射領域を形成するための手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子後に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電板2と各y方向a。b,c,d…の電板4との交点位置の電子機をON状態に

するかのFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電極2と各y方向 a . b . c . d … の電極4との間への逆パイアス電圧印加によ り、 x 方向 A の各電子憑から顧次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他のX方向B。C、D…の包括 2 と各 y 方向 B。 b、 c、 d … の包括 4 との関 への逆パイアス包圧印加によりそれぞれ様原次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子器を駆動し終えた 後に、一の電子線とこれに開接する他の電子器を の間の距離だけ移動物体を提前の移動方向と する方向に90度の方向に移動させ、再び各 X 方向 A . B . C . D … と各 y 方向 a . b . c . d … との交点位置の電子器を頭次駆動する。かかる電子器を動を繰り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ビームにより全面照射することができる。

第4回は、マルチ電子表を電子ビームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

7

第5図は、マルチ電子標を電子ビーム指面装置 に適用した場合を示している。同図において、マ ルチ半導体電子面12は上配第1の実施例で述べ たと同様な構成のものである。19は半導体ウェ ハーであり、20はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射領域である。

前記マルチ電子振12の整動手順は上記第2実施例とほぼ同様であるが、該電子振12の駆動制

上記のように根成されているので、マルチ電子 係12の駆動用の制御信号は、盤送クロックと同時に多重させ光信号として光ファイバー15を介して伝達され、フォトダイオード13で再び電気信号に戻される。マルチ電子様12は高圧電係16が接続されることにより高電圧になっているが、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子限12の光制製信号は、フェトダイ オード13で電気信号に変換され電気制制信号と しての推開制知信号となる。該制製信号はマルチ

8

如はウェハー19のステージ移動に応じ、接回すべき全エリアにおいて電子線12を原次線駆動を行う。

[発明の効果]

さらに、マルチ電子感をマトリクス状に構成して 類次線駆動するため、移動体に同一の電子ビームの照射領域を形成しようとする場合、電子速が 一次元配列である場合に比べて、移動体の移動連

度を低下することができ、数電子と一ムの限制値 域が楕円変形するのを小さくすることができる。 また、電子と一ムの限制領域を追談かつ高密度で 形成できるので、電子線メモリ、技興装置の他、 電子線ブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

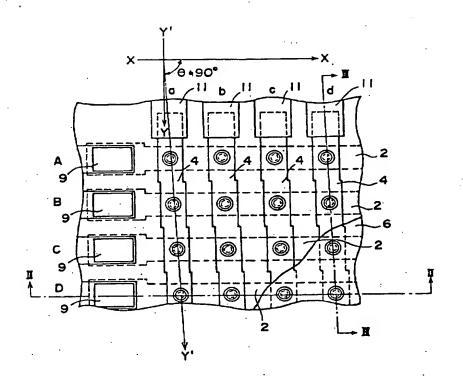
4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の一実施例を示すものであり、第1図はマルチ電子標の平面図、第2図は第1図のⅡ一Ⅱ線に沿う断面図、第3図は第1図のⅢ一Ⅲ線に沿う断面図、第4図は電子ビームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5図は電子ビーム推置装置への応用例を示す平面図である。

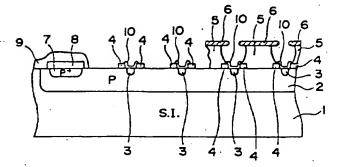
1 … 基板、3 … P型高濃度イオン往入領域(電子限)、10 … ショットキー電極(電子原)、12 … マルチ電子原。

1 1

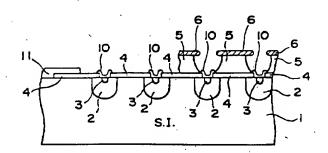
第 | 図



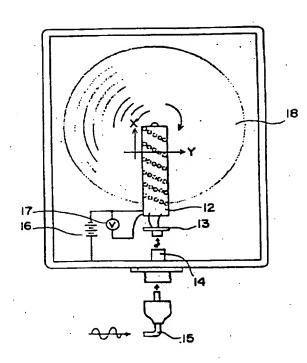
第 2 図



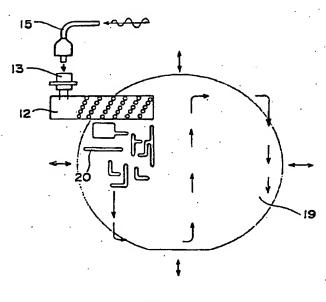
第 3 図



第 4 図



第 5 図



手統補正書(方式)



第 4 図

平成2年 2月 6日

特許庁長官

段

 事件の表示 平成元年特許 顧第267575号

· 2 . 発明の名称 マルチ電子源

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称 (100)キャノン株式会社

代表者 山 路 数 三

4.代理人 〒180 電話03(358)8840

住 所 東京都新宿区本塩町 12

. 四谷ニューマンション107

氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

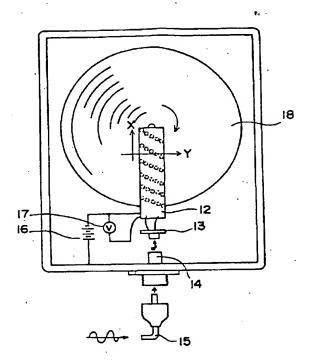
5. 補正命令の日付(発送日) 平成2年 1月30日

8. 補正の対象

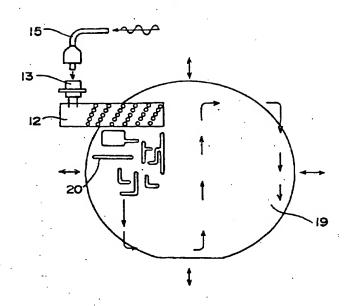
図面 (第4.5図)

7. 補正の内容 別紙の通り





第 5 図



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-127816

(43)Date of publication of application: 30.05.1991

H01L 21/027

G11B 7/125

G11B 7/14

(21)Application number : 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

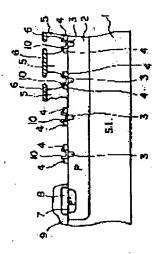
WATANABE NOBUO

OKUNUKI MASAHIKO

(54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row. CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

Best Available Copy at

rejection]

ر د مو

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office